

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5971

SJ 20719 — 1998

碲镉汞晶体 X 值的 X - 射线荧光法测定方法

Method of determination X value for mercury cadmium
telluride for use in X - ray fluorimetry

1998 - 03 - 18 发布

1998 - 05 - 01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

碲镉汞晶体 X 值的 X - 射线
荧光法测定方法

SJ 20719—1998

Method of determination X value for mercury
cadmium telluride for use in X - ray fluorimetry

1 范围

1.1 主题内容

本标准规定了用 X - 射线荧光法测定碲镉汞晶片的组分 X 值。

1.2 适用范围

本标准适用于 X 值在 0.100 ~ 0.350mol 范围内的碲镉汞晶片组分 X 值定量测定。

2 引用文件

GJB 1866 - 94 红外探测器用碲镉汞晶片规范

3 定义

3.1 X 值 X - Value

碲镉汞材料是由 HgTe 和 CdTe 按一定配比组成的合金固熔体, 其镉组元在 $Hg_{1-x}Cd_xTe$ 中的组分比即为 X 值。

3.2 X - 射线荧光测定 X - ray fluorimetry

用 X - 射线照射到被测物质上, 物质内的各元素受激发射出特定波长的荧光 (二次 X - 射线), 根据特征 X - 射线的特定波长以及特定波长射线强度可以定性以及定量测定物质内的各元素含量。

4 一般要求

4.1 测量大气条件